

Работа 3.3.4

Эффект Холла в полупроводниках

Цель работы: измерение подвижности и концентрации носителей заряда в полупроводниках.

В работе используются: электромагнит с источником питания, амперметр, миллиамперметр, милливеберметр, реостат, цифровой вольтметр, источник питания (1,5В), образцы легированного германия..

Экспериментальная установка:

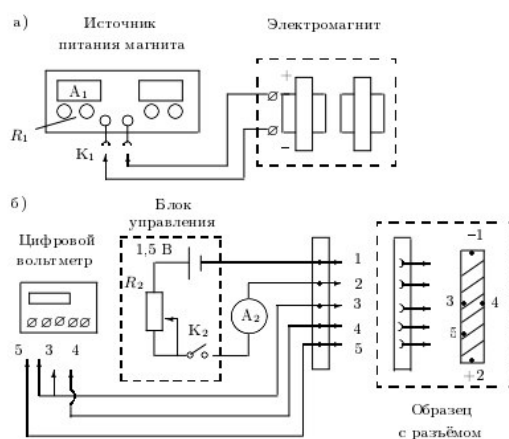


Рис. 1: Схема установки для исследования эффекта Холла в полупроводниках